



대면적 광원을 이용한 시정거리 측정 장치

특허등록번호

10-1525488

특허명

대면적 광원을 이용한 시정거리 측정 장치

대표발명자

광도센터 박성중



비용이 많이 들고 기술의 국산화가 어려운 단점을 극복한 기상관측 측정 기술

기상관측 분야에서 대기의 혼탁 정도, 즉 시정거리를 측정하는 기술은 정렬과 교정이 어려우며 특히 국산화 장비가 매우 부족한 분야입니다.

그러나 KRISS의 연구 기술 '대면적 광원을 이용한 시정거리 측정 장치'기술은 이러한 비용이 많이 들고 기술의 국산화가 어려운 단점을 극복한 기상관측 측정 기술입니다.

